

宇宙硬 X 線偏向度検出器の構成についてのモンテカルロ
シミュレーション*

桜井 敬久**・平山 秀也**・野間 元作**・新関 八郎***
中川 道夫***

(1987 年 5 月 28 日受理)

Optimization of the Design of a Cosmic Hard X-ray
Polarimeter by Monte Carlo Calculation

By

Hirohisa SAKURAI, Hideya HIRAYAMA, Motosaku NOMA, Hachiro NIIZEKI
and
Michio NAKAGAWA

Abstract : The development of a Compton-scatter X-ray polarimeter is taking place to observe the linear polarization of cosmic hard X-ray sources. The polarimeter consists of a scatterer of plastic-scintillator and four NaI scintillation counter to catch scattering X-rays. The size of the scatterer in the 50–100 keV energy range was optimized with the aide of a Monte Carlo simulation assuming the observation of Cyg X-1 at a balloon altitude. The plastic-scintillator of 5 inch in diameter and 6 cm in thickness was better as the scatterer in the calculation. The minimum detectable polarization at 3 standard deviation for Cyg X-1 in a 60 min. observation time is 10 % in the designed detector.

* 宇宙研特別事業費による研究論文

** 山形大学理学部

*** 大阪立立大学理学部

1. はじめに

宇宙X線源の直線偏向度の観測は、カニ星雲のような広がりのあるX線源の磁場構造、Her X-1のようなX線パルス発生機構、そしてCyg X-1のようなアクリーション・ディクスの構造を調べる上で重要である。特に、幾何学的には薄いが光学的に厚いディスクからのX線は、電子散乱を受けるため偏向していると考えられ[1]、硬X線領域では、軟X線より大きく偏向している可能性がある。

今まで、Liを散乱体としたThomson散乱型検出器や石墨結晶反射板のブレガ反射型検出器により数KeV領域の観測が行われており、カニ星雲で19%、Cyg X-1で5%の偏向度を示している[2]、[3]。しかし硬X線での観測結果は、現在まで出されていない。硬X線での偏向度の観測は、X線源の内部構造を直接知る上で非常に重要であり有効な硬X線偏向度検出器の開発が必要である。

我々は、50~100KeV領域の硬X線偏向度検出器としてプラスチックシンチレータを散乱体としたCompton散乱の方位角分布の指向性を利用した検出器の開発を行っている[4]。指向性のよい散乱体の形状を求める事は、この開発の重要な点であるため偏向X線に対するモンテカルロシミュレーション計算を行い、観測に最適な形状を調べた。又、高度 3.5 g/cm^2 でCyg X-1をこの検出器で気球観測した場合の測定可能な偏向度の下限値をバックグラウンドを含めたシミュレーションにより推定した。

2. 偏光度検出器の構成

図1に検出器の構成を示す。円板のプラスチックシンチレータを散乱体として四方を散乱X線検出器であるNaIシンチレーションカウンタで囲んでいる。散乱体は、散乱X線検出器系の中心に置く。入射X線がプラスチックシンチレータでコンプトン散乱をしたときに生じる反跳電子を検出するため、プラスチックシンチレータは光電子増倍管で観かれている。反跳電子と散乱X線の同時計数によりバックグラウンドの除去を行う。NaIシンチレータは、 $15\text{ cm} \times 15\text{ cm}$ 角型であり、コリメータは、観測を考えて $8^\circ \times 8^\circ$ (FWHM)の円筒形する。プラスチックシンチレータは、NE 102 Aとし、その直径及び厚さはモンテカルロシミュレーションにより観測に最適な値を求める。

3. 偏向X線のモンテカルロシミュレーション

偏向度検出器は、散乱X線の方位角分布の指向性を利用して、入射X線の偏光度を測定するものである。従って散乱体は指向性のみで考えれば多重散乱のない点状のものが最適である。しかし、観測においては、面積が大きく且つ検出効率の良い散乱体が必要となる。散乱体の最適な直径、厚さを求めるため偏向X線のプラスチックシンチレータ内での振舞いをモンテカルロシミュレーションにより調べた。このシミュレーション計算は、観測データの処理にも必要となる。

図2にシミュレーションの流れ図を示す。入射X線のエネルギーは、50~100KeVであるので、散乱体内での相互作用は、光電効果、レイリー散乱、コンプトン散乱の三過程と

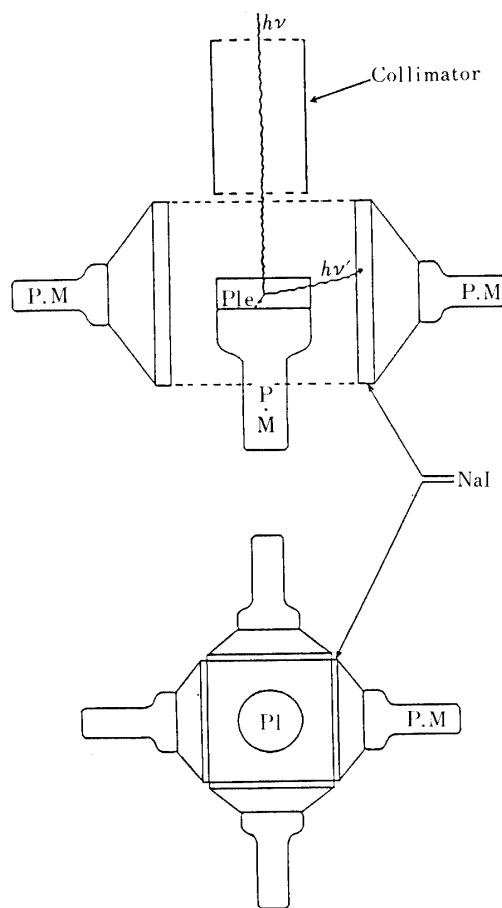
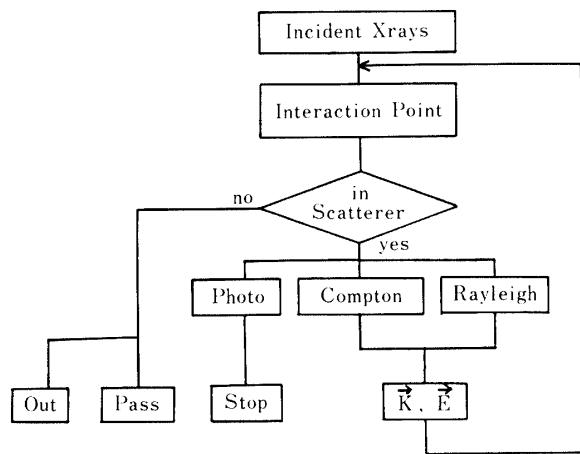


図1 偏光度検出器の構成

図2 偏光 X 線のモンテカルロシミュレーション計算の流れ図
 \vec{K} は、散乱 X 線のエネルギーと方向余弦、 \vec{E} は、その電気ベクトルの方向余弦

した。各相互作用のプラスチックシンチレータでの断面積は、Grodstein[5]の炭素と水素についての断面積とプラスチックシンチレータの炭素と水素の組成比により求めた。入射X線が散乱体内で光電効果を起したときは、stopとし他の2過程のときは、散乱X線のエネルギー、方向及び電気ベクトルを求め追跡を繰り返す。散乱体内で1回も相互作用したい場合はPassとし、1回以上の散乱後、散乱体内より出てきたときはOutとする。入射X線個々の履歴はすべて記録される。

レイリー散乱、コンプトン散乱による散乱角(θ)方位角(φ)及び電気ベクトルは、以下の偏向X線に対する微分断面積の分布を用い、一様乱数を使って求めた。

レイリー散乱

$$d\sigma = r_0^2 (1 - \sin^2 \theta \cos^2 \varphi) d\Omega$$

コンプトン散乱

$$d\sigma = \frac{r_0^2}{2} \frac{K^2}{K_0^2} \left(\frac{K_0}{K} + \frac{K}{K_0} - 2 \sin^2 \theta \cos \varphi \right) d\Omega$$

ここで r_0 は古典電子半径、 $\frac{K}{K_0} = \frac{1}{1 + (E/m_0c^2)(1 - \cos \theta)}$ で E はX線のエネルギー、 m_0c^2 は電子の静止質量である。

以下に、シミュレーションの一例として 60 KeV の偏向X線 30 000 個を直径 $5''\phi$ 、厚さ 6 cm のプラスチックシンチレータ円板全面に一様に垂直入射させたときの結果を示す。図3は、その多数回散乱を含めたOutのX線の方位角分布である。但し、反跳電子のエネ

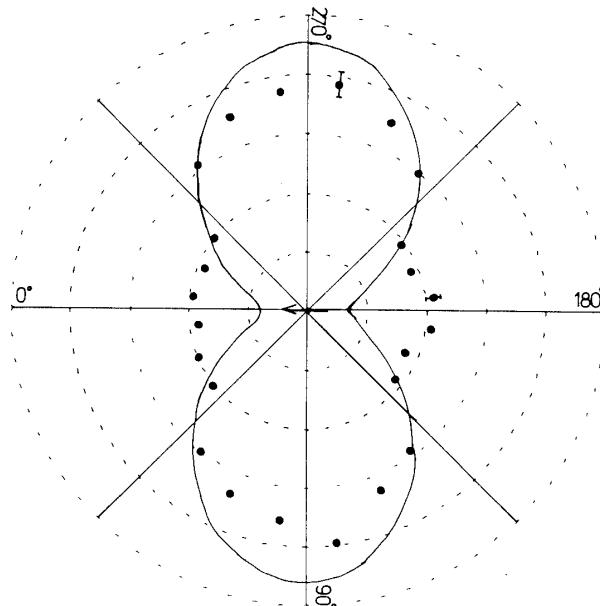


図3 大きさをもつ散乱体全面に一様入射した偏向X線の多数回散乱を含めた散乱X線の方位角分布←は入射X線の電気ベクトルの向き

ルギーを光電子増倍管で検出可能な5KeV以上とし、散乱X線は、四方のNaIシンチレータに入ったものだけを取り出している。方位角は、円板の中心から見て15°毎に四方のNaIシンチレータを区切った範囲を示す。曲線は、Klein-Nishinaの微分断面積を散乱角45°-135°で積分した方位角分布である。指向性を

$$\xi = (N_{\perp} - N_{\parallel}) / (N_{\perp} + N_{\parallel})$$

; N_{\perp} : 電気ベクトルに垂直な面に入った散乱X線の数

N_{\parallel} : 電気ベクトルに平行な面に入った散乱X線の数

で示すと、1点入射で0.43に対し全面入射では0.27であった。方位角0°, 180°でのふくらみは、円板を4辺で囲った影響であると考えられる。図4 a)にOut迄の散乱回数の分布を示す。散乱回数は指数関数的に減少しており平均の散乱回数は約2回である。図4 b)は1, 2, 3各散乱回数で出てきた散乱X線の指向性を示す。3回散乱後でも指向性を残している。点線は、すべての多回散乱を含めた指向性を示す。

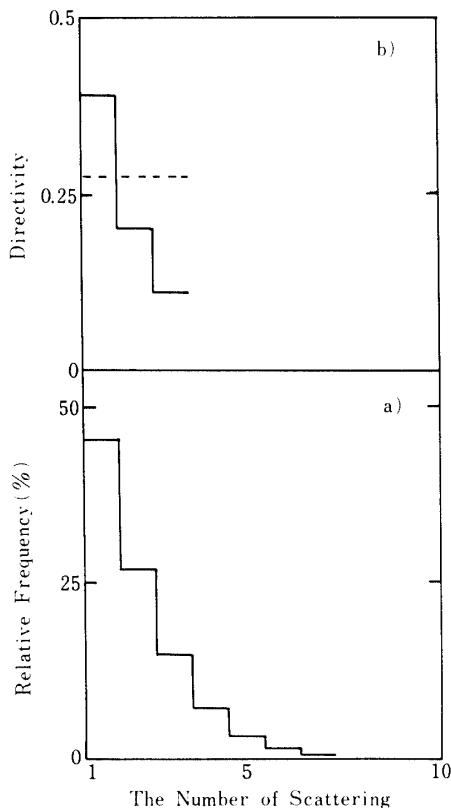


図4 a) 散乱体より出てきた散乱X線の散乱回数分布
b) 各散乱回数に対する指向性 破線は、全散乱の指向性

4. シミュレーションの結果

観測に適した検出器の良さは

$$\alpha = \frac{N_{\perp} - N_{11}}{\sqrt{N_{\perp} + N_{11}}}$$

により決められる。

多数回散乱を含めた指方性を ξ , 検出効率(入射 X 線に対する Out の散乱 X 線の数の比)を η とすると観測される偏向度は,

$$P = \frac{\alpha \sqrt{I_x + I_B Q}}{I_x}, \quad \frac{1}{\xi \sqrt{\eta} \sqrt{AT}}$$

となる。

ここで, I_x は X 線源の強度, $I_B Q$ はバックグラウンドの強度, A , T は各々, 散乱体の面積と観測時間である。

又, 1 回散乱にのみ注目したときは, 1 回散乱の指向性を ξ_1 , 検出効率を η_1 とすると

$$P = \frac{\alpha \sqrt{I_x + I_B Q}}{I_x} \cdot \frac{\sqrt{\eta}}{\xi_1 \eta_1 \sqrt{AT}}$$

となる。

ここで

$$Q_M = \frac{1}{\xi \eta \sqrt{AT}}, \quad Q_1 = \frac{\sqrt{\eta}}{\xi_1 \eta_1 \sqrt{AT}}$$

は, 検出器の検出効率を含めた良さの指標となり小さな値ほど良い。

図 5 は, 5"φ, 6 cm 厚のプラスチックシンチレータの Q_M , Q_1 の偏向 X 線の入射エネル

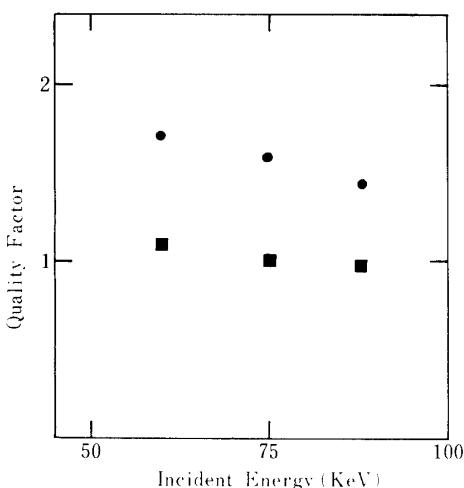


図 5 Q_M , Q_1 値の入射偏向 X 線のエネルギーに対する依存性(本文参照) ● : Q_1 , ■ : Q_M

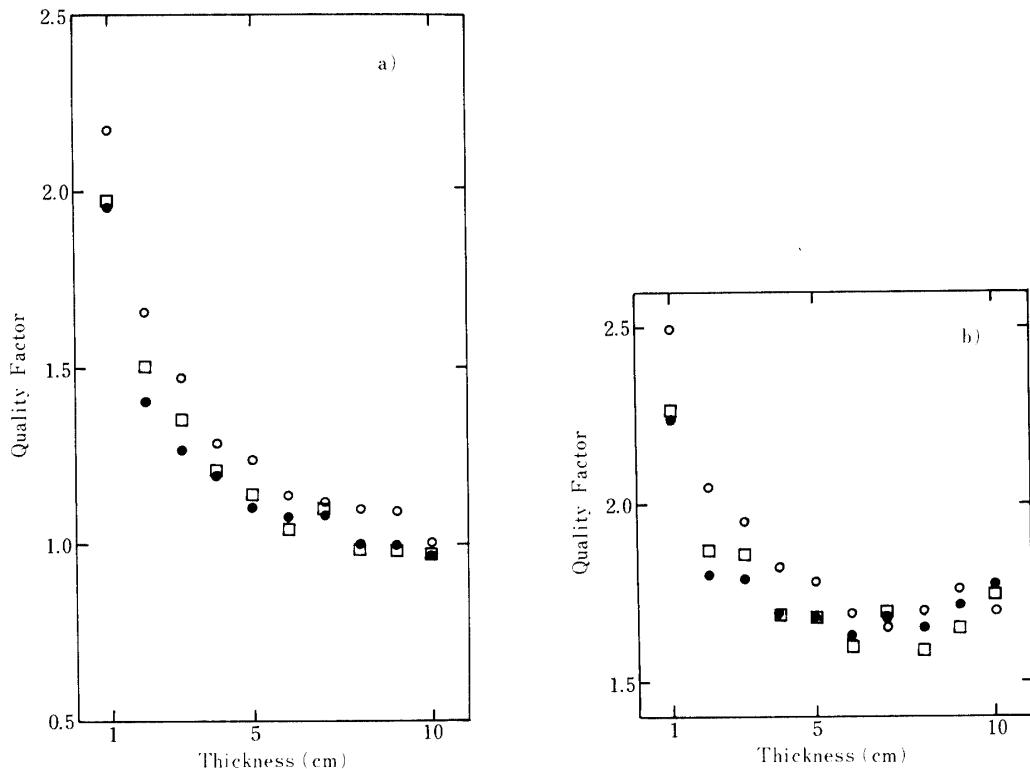


図6 各直径の散乱体の厚さに対する a) Q_M 値, b) Q_1 値 ● : $6''\phi$,
 □ : $5''\phi$, ○ : $4''\phi$

ギーに対する依存性を示している。全体に緩やかな減少傾向は、コンプトン散乱の断面積が50~100 KeVのエネルギー付近では小さな変化である事による。 Q_1 の減少率が大きいのは、エネルギーとともに指向性が良くなる事による。

このように散乱体の大きさは、入射偏向X線のエネルギーに依存するので、Cyg X-1を高度 3.5 g/cm^2 で観測する場合の最適な散乱体の直径、厚さを調べた。シミュレーションは、50,000個の入射偏向X線のエネルギーを Cyg X-1のエネルギースペクトラムに合わせて行った。

図6 a), b)は、直径が $4''\phi$, $5''\phi$, $6''\phi$ の各厚さに対する Q_M , Q_1 を示している。 Q_1 は、厚さ 6 cm 付近が極小となっており Q_M も 6 cm 付近からの減少率が小さくなっている。 Q_M が 6 cm より厚くても減少するのは、 ξ が一定でその場合の割合が大きくなるからである。

シミュレーションの結果は、反跳電子の検出効率を厚さに対して一様としたとき、直径 $5''\phi$ 、厚さ 6 cm のプラスチックシンチレータが散乱体として適当である事を示している。又、この散乱体の偏向度検出器によって Cyg X-1 を高度 3.5 g/cm^2 で 60 分観測したとき、大気バックグラウンドを考慮したシミュレーションでは、 3σ での観測可能な偏向度の下限値は 10.1% であった。

このシミュレーション計算は、山形大学情報処理センターにおいて行った。

参考文献

- [1] R. A. Sumyaev and L. G. Titarchuk Astron. Astrophys. **143**, 374 (1985)
- [2] M. C. Weisskopf, E. H. Silver, H. L. Kestenbaum, K. S. Long and R. Novick Ap. J. (Letters) **220** L 117 (1978)
- [3] K. S. Long, G. A. Chann and R. Novick Ap. J. **238**, 710 (1980)
- [4] 桜井敬久, 新関八郎, 野間元作, 前沢潔, 中川道夫, 大気球シンポジウム p 125 (1983)

- [5] G. W. Grodstein National Bureau of Standards Report NBS-583 (1957)